



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets



(11)

EP 3 292 371 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(15) Korrekturinformation:

Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:

G01B 11/25 (2006.01) **G06T 7/00 (2017.01)**

(48) Corrigendum ausgegeben am:

19.08.2020 Patentblatt 2020/34

(86) Internationale Anmeldenummer:

PCT/EP2016/060073

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
06.05.2020 Patentblatt 2020/19

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2016/177820 (10.11.2016 Gazette 2016/45)

(21) Anmeldenummer: **16720430.4**

(22) Anmeldetag: **04.05.2016**

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM RÄUMLICHEN VERMESSEN VON OBERFLÄCHEN

DEVICE AND METHOD FOR SPATIALLY MEASURING SURFACES

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE MESURE DE SURFACES DANS L'ESPACE

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

• **NOTNI, Gunther**

07749 Jena (DE)

• **SROKOS, Kevin**

07745 Jena (DE)

• **LUTZKE, Peter**

07749 Jena (DE)

• **SCHMIDT, Ingo**

07751 Jena (DE)

• **KÜHMSTEDT, Peter**

07751 Jena (DE)

(30) Priorität: **05.05.2015 DE 102015208285**

(74) Vertreter: **Pfenning, Meinig & Partner mbB**

Patent- und Rechtsanwälte

Joachimsthaler Straße 10-12

10719 Berlin (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

14.03.2018 Patentblatt 2018/11

(56) Entgegenhaltungen:

WO-A2-2014/000738 DE-A1- 10 355 010

DE-A1-102010 006 105 US-A1- 2014 078 264

US-B1- 6 542 250

(73) Patentinhaber:

- **Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.**
80686 München (DE)
- **Friedrich-Schiller-Universität Jena**
07743 Jena (DE)

(72) Erfinder:

- **HEIST, Stefan**
07743 Jena (DE)